

WL25 Series

Automated Test Equipment

Linear IC Test System

リニアICテストシステム

概要

WL25シリーズは、高精度なDCパラメータ測定、波形解析、時間測定の機能を備え、柔軟性と拡張性を兼ね備えた生産工程に最適に対応ができるテストシステムです。

テストシステムのOS（オペレーティングシステム）は、世界で広く使用されているWindowsを採用し、使い慣れた操作性の高い環境を提供しています。プログラミング言語は、C言語に準拠した計測用C言語（Tester-C）を開発し使用しています。

基本システムは、パーピンソース（最大512ピン）をベースとしたDC測定機能で構成され、1/2/4/8/16個のデバイス同時測定が可能です。また、タイム、DSP、ファンクション各モジュールの追装が可能です。



特長

- 同時測定機能
 - 1/2/4/8/16 DUTs 同時測定
 - パワーデバイスの4個同時測定 (4DGS)
 - 2ステーションでの交互試験
- 高測定精度
 - DC測定精度: $\pm 0.05\%$
 - ノイズ低減のためのモジュールとシステム電源の分離
- オペレーティング環境
 - 2台のCPUとWindows GUI
 - 計測用C言語ベースのシステムソフト
 - デバッグツール
 - オフライン環境でのプログラム作成やコンパイル作業
- フレキシブルなシステム構築
 - 豊富な種類のV/Iソース
 - タイム、DSP、ファンクション各オプションの追装が可能

規格

- パーピンソース 最大512ピン ($\pm 32\text{ V}/\pm 32\text{ mA}$)
- DC ボルトメータ 2入力
 - $\pm 32\text{ V max. (Direct input)}$
 - $\pm 512\text{ V max. (ATT. input)}$
- V/Iソース
 - $\pm 50\text{ V}/\pm 250\text{ mA}$
 - $\pm 128\text{ V}/\pm 250\text{ mA} (\pm 40\text{ V}/\pm 2\text{ A})$
- パワーV/Iソース $\pm 30\text{ V}/\pm 30\text{ A}$
 $\pm 60\text{ V}/\pm 10\text{ A}$
- ハイボルテージV/Iソース
 - $+2000\text{ V}/\pm 20\text{ mA}$
 - $-500\text{ V}\sim+800\text{ V}/\pm 200\text{ mA}$
- タイムモジュール
 - 10 nsec \sim 6 sec
 - 測定分解能: 100 psec
 - 測定精度: $\pm(10\text{ ppm} + 10\text{ nsec})$
- ファンクションテストレート
 - 5 MHz、64ピン デジタルI/O
- DSPモジュール
 - AFG: 16 bits/10 Mbps
 - ADGT: 16 bits/10 Mbps
 - VFG: 14 bits/240 Mbps
 - VDGT: 14 bits/80 Mbps
- 同時測定数
 - 1/2/4/8/16 DUTs
 - (DCテスト時は、最大32 DUTs)

ターゲットデバイス

レギュレータ、オペアンプ、コンパレータ、MOS-FET、オーディオアンプ、IPD、モータドライバIC